



26. Oktober
09:00 bis 17:00 Uhr
Waldbronn

TopMap Day

Workshop zur Oberflächenmesstechnik



Welche Messmethode zur Charakterisierung von Oberflächen ist für welche Messaufgabe geeignet? Wie bestimmen Sie Ebenheit, Parallelität, Rauheit, Form- und Oberflächenparameter sowie Stufenhöhen am einfachsten? Welche Vor- und Nachteile bringen verschiedene Verfahren im Arbeitsalltag mit sich?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich der TopMap Day im persönlichen Austausch zwischen Referenten und TeilnehmerInnen.



Im Praxisteil des Workshops beraten Sie unsere ExpertInnen zu Ihrer individuellen Messaufgabe und **analysieren Ihre mitgebrachte Messprobe**. Gerne stellen wir Ihnen dafür einen Messbericht aus. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Probe vorab an unten genannte Adresse mit dem Betreff „TopMap Day“ einsenden.



Der Workshop richtet sich an MesstechnikerInnen, TechnikerInnen im Labor, MitarbeiterInnen der Qualitätssicherung, KonstrukteurInnen, QualitätsmanagerInnen sowie FertigungsplanerInnen und ProjektmanagerInnen.



Die Teilnehmerzahl ist auf **10 bis max. 25 Personen** begrenzt. **Der Workshop ist in diesem Jahr kostenlos**. Während der gesamten Veranstaltung sorgen wir zudem für die gastronomische Versorgung. Anreise-, Übernachtungs- und individuelle Aufenthaltskosten sind von den TeilnehmerInnen selbst zu tragen.



Sie erhalten ein Teilnehmerzertifikat, die Workshopunterlagen und Ihren persönlichen Messbericht.

Auf der Folgeseite finden Sie die [Agenda](#) zum Workshop. Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 2022.

Online anmelden

SPECIAL
GUEST



Gastvortrag
IMS Chips

Dr. Björn Albrecht

*Leiter der Abteilung Advanced Packaging
am Institut für Mikroelektronik, Stuttgart (IMS Chips)*

In seinem Vortrag „Anwendungen in den Bereichen MEMS, Nanostrukturierung und Halbleiterintegration“ berichtet er über den Einsatz optischer Messtechnik bei der Herstellung von ultradünnen Chips in Folie.



26. Oktober
09:00 bis 17:00 Uhr
Waldbronn

TopMap Day

Workshop zur Oberflächenmesstechnik

Agenda

- **Einführung und Vorstellung der Polytec GmbH**
- **Einsatzbereiche der optischen Oberflächenmesstechnik**
 - Warum messen?
 - Warum optisch?
 - Verschiedene optische Messtechnologien im Überblick
- **Grundlagen der Weißlichtinterferometrie**
 - Funktionsprinzip
 - Weiterverarbeitung der Messdaten – Filterung, Ermitteln von Kennwerten (Ebenheit, Rauheit u.v.m.)
 - Allgemeine Anwendungsgebiete
- **Gastvortrag IMS Chips – Institut für Mikroelektronik Stuttgart**
Dr. Björn Albrecht, Abteilungsleiter Advanced Packaging
 - Anwendungen in den Bereichen MEMS, Nanostrukturierung und Halbleiterintegration
- **Normungsaktivitäten und Faires Datenblatt**
 - Aktueller Stand der Normung
 - ISO 25178 und Änderungen in der neuen **ISO 21920** zur ISO 4287
 - Vergleichbarkeit durch praxisfreundliche Datenblätter
- **Anwendungsbeispiele mikro- und makroskopischer Weißlichtinterferometrie**
 - Warum 3D statt 2D messen?
 - Anwendung der ISO 25178 in der Praxis
- **Live-Demonstration**
verschiedener Oberflächenmesssysteme und Software
- **Analyse Ihrer Messaufgabe anhand Ihrer Proben**
Messproben, die wir aus zeitlichen Gründen nicht während des Workshops analysieren können, vermessen wir gerne im Nachgang und senden Ihnen einen Messbericht zu – ohne Zusatzkosten.

Online anmelden



Dr. Özgür Tan
Strategischer Produktmanager



M. Sc. Jan Zepp
Applikationsingenieur



Dr. Josef Frohn
Vertriebsingenieur